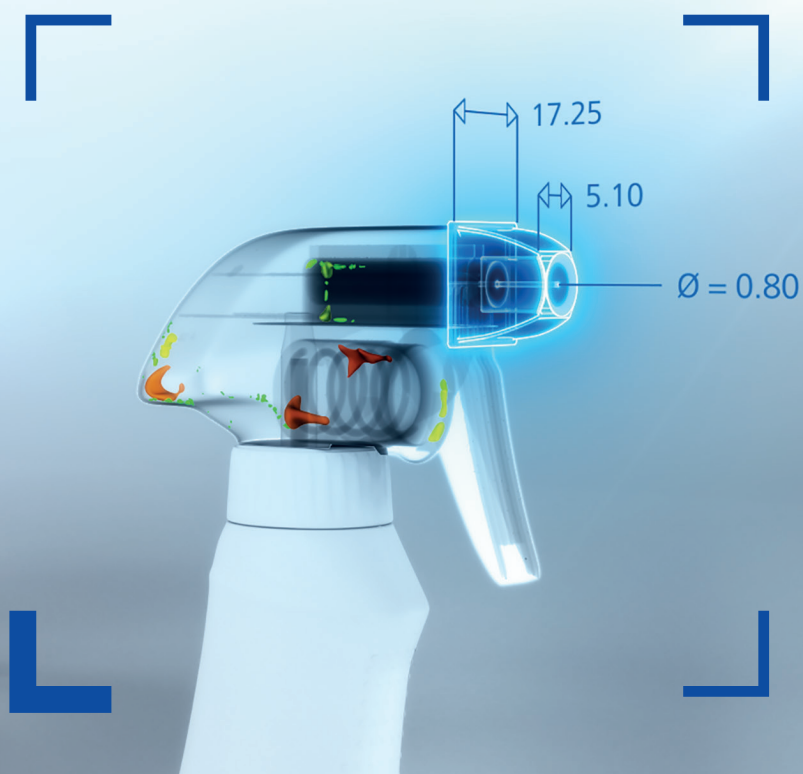




Seeing beyond



仅需一次，见所未见 简捷新高度

ZEISS METROTOM 1

ZEISS METROTOM 1 的 CT 技术便捷，用户仅需一次扫描即可有效完成复杂的测量与检测任务，从而对接触式和光学测量系统无法检测到的隐蔽缺陷与内部结构进行测量、分析及检测。

zeiss.com/metrotom1



Seeing beyond



介绍

工业计算机断层扫描

计算机断层扫描（CT）是一种计算机辅助的无损扫描过程，可广泛应用于工业领域。CT扫描过程利用X射线使被扫描部件的内部和外部结构以及缺陷可视化，同时提供完整的3D数据。ZEISS工业CT解决方案是优化质量保证和过程控制的理想选择，具有提高资源利用率和易于使用的特点——测量和检查，一气呵成！



一次扫描，全面确定



无损扫描



省去耗时的夹持步骤



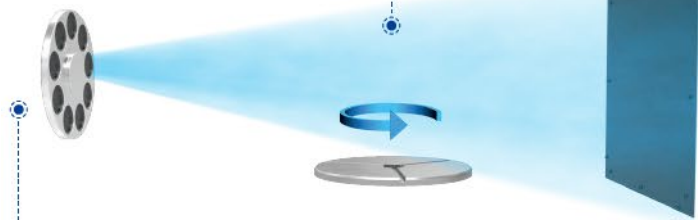
检查内部结构和缺陷

功能

CT工作原理

转台

转台是扫描过程中的重要组件，可完整采集部件。



X射线管

从X射线管中产生的X射线能够穿透样品。

平板探测器

通过平板探测器来探测穿透部件的X射线。

应用

CT提供的功能

检查

通过该技术可有效实行装配控制和缺陷分析等。



测量

使用ZEISS METROTOM系列的CT系统，可按照测量规范进行测量。

集多优势于一体



操作便捷

ZEISS METROTOM 1 的安装无需耗费过多时间，仅需要少量培训即可安全操作



精准测量

进行数模比对、尺寸测量和壁厚分析，获得精准结果



占地面积小

CT 系统的尺寸为 1750(W) × 1820(H) × 870(D)mm，适合各类测量实验室



更快的投资回报

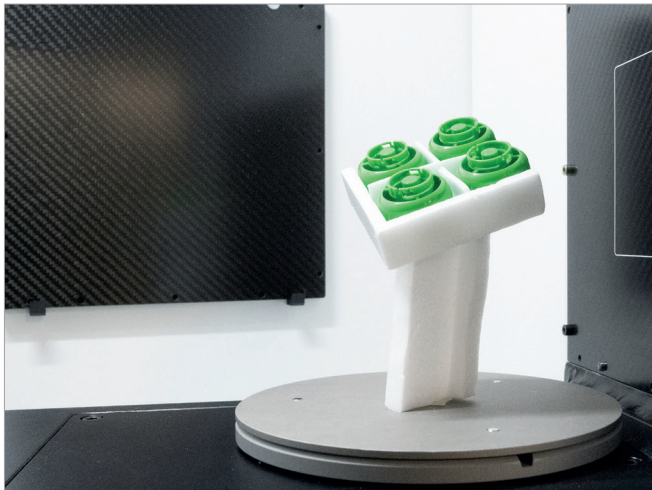
低维护系统确保设备采购及持有成本更低

应用

无论中小尺寸样品、还是塑料、轻金属材质，借助 METROTOM 1，可检测多样化的部件，例如连接器、塑胶瓶盖、铝制品等。

技术规格

X 射线源	160 kV
X 射线探测器	2.5 k (2,500 x 2,500)
测量范围	165 x 140 mm
测量精度 球心距误差 (SD)	5 μm + L/100
外形尺寸 (WxHxD)	1,750 x 1,820 x 8,70 mm
重量	2,100 kg
软件 (包含)	GOM Volume Inspect



高分辨力选项

HR 选项大幅提升分辨力，确保更佳的缺陷检测能力以及部件的功能与质量。

- 洞悉更小细节以避免缺陷的漏检
- 提升图像质量
- 标准及高分辨力模式的简易切换
- HR 选项可由用户简捷安装



深圳思诚资源科技有限公司
SHENZHEN SCZY TECHNOLOGY CO.,LTD.

电话/Tel: 0769-22186189

网址/Web: www.sczy.com

邮箱/E-mail: sales@sczy.com

地址/Adr: 广东省东莞市长安镇长青南路1号万科中心1906



微信公众平台